

### JIS 確認の申出に係る審議について

日本産業規格（以下、JIS という。）は、産業標準化法に基づき、JIS を制定又は確認若しくは改正した日から少なくとも 5 年を経過するまでに見直す必要があります。多数の JIS があることから効率的な運用のために、毎年度一括して JIS 見直しを行うこととしております。JIS の見直しの流れ及び産業標準作成委員会の審議方法は、別添 1 をご参照ください。

今回のご審議は、別添 1 の（3）JIS 確認の申出に係る審議です。

前回の電子分野産業標準作成委員会（2021 年 12 月 17 日議決）でご承認いただいた、2022 年度に見直し期限を迎える電子分野の JIS のうち 2022 年度中の公示予定を「確認」とする JIS について、JSA ウェブサイトに JIS 作成予定一覧表の公表を掲載し、利害関係者の意向を確認したところ、利害関係者からのご意見等はありませんでした。

この結果を踏まえて、別添 2 に、2022 年度中の公示予定を「確認」とする JIS 及び作成審議経過等を作成いたしましたので、これらの JIS を「確認」としてよろしいか最終のご審議をお願いいたします。

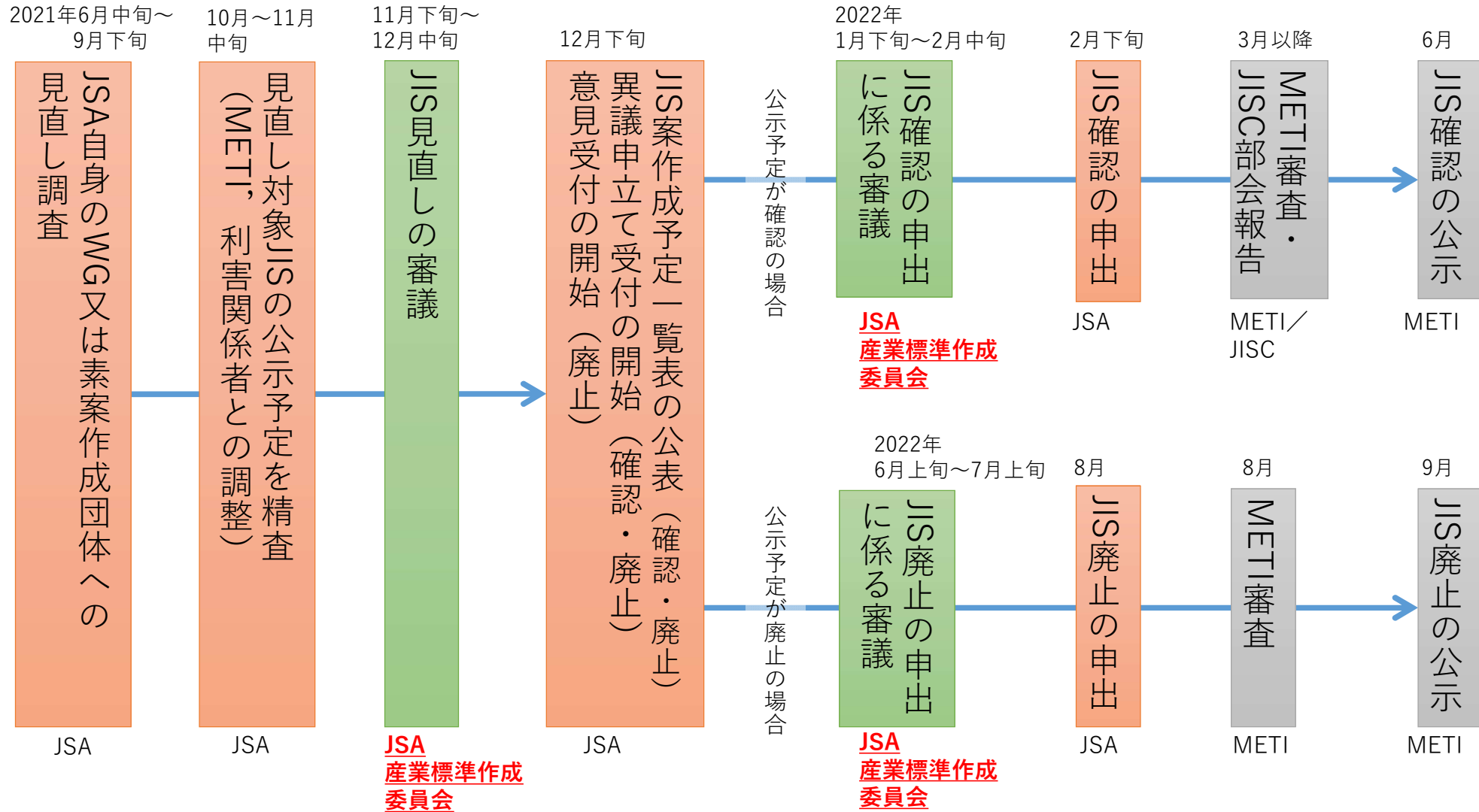
委員会において議決された場合には、産業標準化法第 16 条において準用する同法第 14 条第 1 項の規定に基づき、主務大臣に申出いたします。

なお、字句等編集上の修正については、産業標準作成委員会事務局に一任いただきますようお願いいたします。

注記 JIS 法令上、別添 2 別紙 2 の 3. ②JIS 作成予定一覧表の公表、③利害関係者の産業標準作成委員会への参加の確保及び④異議申立ての機会の確保は、主務大臣に対して申出を行うまでの過程において行うこととしております。審議中又は審議後に意見等があった場合で、議決結果の変更又は意見等を採用しない場合は、再度、産業標準作成委員会にお諮りいたします。

# JISの見直しに関する審議

## (1) JIS見直しの流れ



## (2) JIS見直しの審議について

目的： 次年度に5年見直し期限を迎えるJISについて、「改正」、「確認」又は「廃止」のいずれにするかの見直し方針を決定します。

1. 利害関係者の意見を確認するため、JSAが見直し対象のJISを抽出し、調査します。
  - ※ 見直し対象は、次年度に5年見直し期限を迎えるJISです。
  - ※ 技術的動向、対応国際規格や引用規格の改正・廃止などを背景に、JISを改正する必要があるのか、確認でよいのか、又は廃止するかなどを調査します。

## (2) JIS見直しの審議について (続き)

2. JSAが調査結果に基づき、それぞれのJISについて「改正」、「確認」又は「廃止」のいずれにするかの案（以下、JIS見直し案という。）を理由とともに作成します。

その際には、必要に応じて、JSA自身のWG又は素案作成団体に事実確認を行います。

その後、産業標準作成委員会にお諮りします。

- ※ 当該JISが次に該当し、次年度までに「改正」又は「廃止」の公示を予定している場合は、JIS見直し案を「改正」又は「廃止」とします。
- ※ 当該JISが次に該当し、これから改正又は廃止に着手するため、次年度までに「改正」若しくは「廃止」の公示ができない場合、又は次に該当しない場合は、JIS見直し案を「確認」とします。

改正又は廃止が必要な要因
市場実態又は技術動向に合わせ、最適な技術内容とすべく、規定内容の変更が必要
社会的要因で規定内容の変更が必要（環境問題など）
対応国際規格の改正又は廃止があり、規定内容の変更が必要
対応すべき国際規格が新たに制定され、それに整合することが必要
引用規格の改正及び/又は廃止があり、規定内容の変更が必要
引用すべきJISが新たに制定された
整合すべき（参照している）法規の改正及び/又は廃止があり、規定内容の変更が必要
整合すべき（参照している）すべき法規が新たに制定された
技術の陳腐化・利用の縮小等、JISの廃止が妥当

## (2) JIS見直しの審議について (続き)

3. 産業標準作成委員会でJIS見直し案をご審議いただきます。
  - ※ JIS見直し案の資料については、JSAで事実確認を行っております。
  - ※ 対応国際規格などの改廃状況は、資料2別添2の参照文書（JSA調査結果）に記載しております。
  - ※ ご承認いただいたJIS見直しのうち、公示予定が「確認」及び「廃止」のJISは、JIS作成予定一覧表としてJSAホームページに掲載します。  
(利害関係者に対する産業標準作成委員会への参加の機会の確保及び異議申立ての機会の確保のため)

### (3) JIS確認の申出に係る審議

目的： 利害関係者の意向を適切に反映するためのプロセスを経て、主務大臣にJISの確認の申出をしてよいかどうかを決定します。

1. 確認のJIS作成予定一覧表の公表によって、利害関係者の意向を確認した後、JSAが日本産業規格作成審議経過報告書（確認）を作成します。
  - ※ 当該報告書では、確認の申出を行う対象JIS、確認する理由、認定機関としてのプロセスの結果（JIS見直しの審議～確認のJIS作成予定一覧表の公表の結果）を示しております。
2. 産業標準作成委員会で日本産業規格作成審議経過報告書（確認）に基づき、ご審議いただきます。
  - ※ JIS見直しの審議の結果から変更がある場合は、JSAからその旨産業標準作成委員会にご報告いたします。
3. 産業標準作成委員会で承認されたJISは、JSAから主務大臣へJISの確認の申出を行います。

日本産業規格作成審議経過報告書（確認）

**1. 確認の申出を行う日本産業規格**

JIS C 5101-20 電子機器用固定コンデンサー—第 20 部：品種別通則：表面実装用固定メタライズドポリフェニレンスルフィドフィルム直流コンデンサ 外 56 件（別紙 1 のとおり）

**2. 確認の申出を行う日本産業規格に係る主務大臣**

経済産業大臣専管

**3. 確認の理由**

別紙 1 の日本産業規格は、産業標準化法第 17 条の規定による見直し期限を 2022 年度に迎えるものであるが、認定産業標準作成機関として、関係各方面の意見を調査し検討した結果、現行の日本産業規格がなお適正であると認められることから、確認すべきものとして申出する。

**4. 確認の申出を行う日本産業規格の作成及び審議に関する事項**

(1) 認定産業標準作成機関名；一般財団法人日本規格協会（JSA）

(2) 法令上の区分；

産業標準化法第 16 条において準用する同法第 14 条第 1 項に基づく申出

(3) 産業標準作成委員会名；

電子分野産業標準作成委員会

(4) 産業標準作成委員会の委員構成表及び開催状況；

別紙 2 に記載のとおり。

(5) 作成審議経過

別紙 2 に記載のとおり。

以上

## 確認の申出を行う日本産業規格

No.	規格番号	規格名称
1	C5101-20	電子機器用固定コンデンサー第20部：品種別通則：表面実装用固定メタライズドポリフェニレンスルフィドフィルム直流コンデンサ
2	C5101-23	電子機器用固定コンデンサー第23部：品種別通則：表面実装用固定メタライズドポリエチレンナフタレートフィルム直流コンデンサ
3	C5101-23-1	電子機器用固定コンデンサー第23-1部：ブランク個別規格：表面実装用固定メタライズドポリエチレンナフタレートフィルム直流コンデンサ 評価水準E Z
4	C5101-24	電子機器用固定コンデンサー第24部：品種別通則：表面実装用固定タンタル固体（導電性高分子）電解コンデンサ
5	C5101-25	電子機器用固定コンデンサー第25部：品種別通則：表面実装用固定アルミニウム固体（導電性高分子）電解コンデンサ
6	C5101-26-1	電子機器用固定コンデンサー第26-1部：ブランク個別規格：固定アルミニウム固体（導電性高分子）電解コンデンサ 評価水準E Z
7	C5101-8	電子機器用固定コンデンサー第8部：品種別通則：固定磁器コンデンサ種類1
8	C5101-9	電子機器用固定コンデンサー第9部：品種別通則：固定磁器コンデンサ種類2
9	C5160-1	電気及び電子機器用固定電気二重層コンデンサー第1部：品目別通則
10	C5381-22	低圧サージ防護デバイス第22部：通信及び信号回線に接続するサージ防護デバイス（SPD）の選定及び適用基準
11	C5402-11-8	電子機器用コネクタ試験及び測定第11-8部：耐候性試験—試験11h：砂じん
12	C5402-12-6	電子機器用コネクタ試験及び測定第12-6部：はんだ付け試験—試験12f：自動はんだ付けにおけるフラックス及び洗浄液に対する封止
13	C5402-1-3	電子機器用コネクタ試験及び測定第1-3部：一般検査—試験1c：電氣的接触長
14	C5402-13-2	電子機器用コネクタ試験及び測定第13-2部：機械的動作試験—試験13b：挿入力及び引抜き力
15	C5402-1-4	電子機器用コネクタ試験及び測定第1-4部：一般検査—試験1d：コンタクトの保護効果（スクーププルーフ）
16	C5402-14-7	電子機器用コネクタ試験及び測定第14-7部：封止（気密性）試験—試験14g：噴射水
17	C5402-15-8	電子機器用コネクタ試験及び測定第15-8部：コネクタ試験（機械的試験）—試験15h：コンタクト保持機構、工具の使用に対する耐久性
18	C5402-16-2	電子機器用コネクタ試験及び測定第16-2部：コンタクト及びターミネーションの機械的試験—試験16b：リストラクテッドエントリ
19	C5402-16-20	電子機器用コネクタ試験及び測定第16-20部：コンタクト及びターミネーションの機械的試験—試験16t：機械的強度（無はんだ接続のターミネーション）
20	C5402-16-4	電子機器用コネクタ試験及び測定第16-4部：コンタクト及びターミネーションの機械的試験—試験16d：引張強度（圧着接続）
21	C5402-16-5	電子機器用コネクタ試験及び測定第16-5部：コンタクト及びターミネーションの機械的試験—試験16e：ゲージ保持力（弾性コンタクト）
22	C5402-16-7	電子機器用コネクタ試験及び測定第16-7部：コンタクト及びターミネーションの機械的試験—試験16g：圧着後のコンタクトの変形



		測定
23	C5402-17-3	電子機器用コネクタ試験及び測定—第17-3部：ケーブルクランプ試験—試験17c：ケーブルクランプ強度（ケーブルの引張り）
24	C5402-19-3	電子機器用コネクタ試験及び測定—第19-3部：耐化学薬品試験—試験19c：耐液性
25	C5630-26	マイクロマシン及びMEMS—第26部：マイクロトレンチ構造及びマイクロニードル構造の寸法、形状表示及び計測法
26	C5914	光サーキュレータ通則
27	C5916	光伝送用分散補償器通則
28	C5954-3	光伝送用能動部品—試験及び測定方法—第3部：単心直列伝送リンク用光送・受信モジュール
29	C5962	光ファイバコネクタ通則
30	C5964-4-100	光ファイバコネクタかん合標準—第4-100部：SC形光ファイバコネクタ類—SC-PC簡易レセプタクル（F16形）
31	C5964-5	光ファイバコネクタかん合標準—第5部：MTコネクタ類（F12形）
32	C5964-6-100	光ファイバコネクタかん合標準—第6-100部：MU形光ファイバコネクタ類—MU-PC簡易レセプタクル（F17形）
33	C5965-3-31	光ファイバ接続デバイス及び光受動部品—光ファイバコネクタ光学互換標準—第3-31部：シングルモード光ファイバ用1列多心角形ポリフェニレンスルフィド（PPS）8度斜めPC端面フェルールの接続部パラメータ
34	C5981	F12形多心光ファイバコネクタ（MTコネクタ）
35	C60063	抵抗器及びコンデンサの標準数値
36	C60068-2-77	環境試験方法—電気・電子—表面実装部品（SMD）の本体強度及び耐衝撃性試験方法
37	C60068-3-13	環境試験方法—電気・電子—第3-13部：支援文書及び指針—はんだ付け
38	C6122-10-4	光増幅器—測定方法—第10-4部：マルチチャネルパラメータ—光スペクトラムアナライザを用いた補間法
39	C6122-4-3	光増幅器—測定方法—第4-3部：過渡パラメータ—パワー制御単一チャネル光増幅器のパワーパラメータ測定
40	C61300-2-1	光ファイバ接続デバイス及び光受動部品—基本試験及び測定手順—第2-1部：正弦波振動試験
41	C61300-2-15	光ファイバ接続デバイス及び光受動部品—基本試験及び測定手順—第2-15部：結合部ねじり試験
42	C61300-2-21	光ファイバ接続デバイス及び光受動部品—基本試験及び測定手順—第2-21部：混合温湿度サイクル試験
43	C61300-2-26	光ファイバ接続デバイス及び光受動部品—基本試験及び測定手順—第2-26部：塩水噴霧試験
44	C61300-2-5	光ファイバ接続デバイス及び光受動部品—基本試験及び測定手順—第2-5部：光ファイバクランプ強度試験（ねじり）
45	C61300-2-9	光ファイバ接続デバイス及び光受動部品—基本試験及び測定手順—第2-9部：衝撃試験
46	C61300-3-11	光ファイバ接続デバイス及び光受動部品—基本試験及び測定手順—第3-11部：結合力及び離脱力測定
47	C61300-3-24	光ファイバ接続デバイス及び光受動部品—基本試験及び測定手順—第3-24部：偏波面保存光ファイバ付き光ファイバコネクタのキー位置精度測定
48	C61300-3-27	光ファイバ接続デバイス及び光受動部品—基本試験及び測定手順—第3-27部：多心光ファイバコネクタプラグの穴位置測定
49	C61300-3-32	光ファイバ接続デバイス及び光受動部品—基本試験及び測定手順—第3-32部：光受動部品の偏波モード分散測定

50	C61300-3-34	光ファイバ接続デバイス及び光受動部品—基本試験及び測定手順—第3-34部：ランダム接続時の挿入損失
51	C61300-3-36	光ファイバ接続デバイス及び光受動部品—基本試験及び測定手順—第3-36部：光ファイバコネクタフェルールの内径及び外径の測定
52	C61300-3-43	光ファイバ接続デバイス及び光受動部品—基本試験及び測定手順—第3-43部：光ファイバ光源のモードトランスファファンクション測定
53	C61300-3-7	光ファイバ接続デバイス及び光受動部品—基本試験及び測定手順—第3-7部：シングルモード光部品の光損失及び反射減衰量の波長依存性測定
54	C6183-2	光スペクトラムアナライザ—第2部：校正方法
55	C6704	人工水晶
56	C6835	石英系シングルモード光ファイバ素線
57	C6842	光ファイバ偏波モード分散試験方法

## 1. 産業標準作成委員会の委員構成表

## 1. 1 電子分野産業標準作成委員会

	氏名	所属	種別
(委員長)	平本 俊郎	東京大学	中立者
(委員)	藤井 哲郎	東京都市大学	
	山田 誠	大阪府立大学	
	山口 大輔	総務省国際戦略局通信規格課	
	内藤 恵美子	公益社団法人日本消費生活アドバイザー・ コンサルタント・相談員協会	使用者
	河村 真紀子	主婦連合会	
	松井 隆	日本電信電話株式会社	
	石井 紀彦	日本放送協会	
	(関係者)	諏訪 正樹	KOA株式会社
渋谷 隆		株式会社白山	
後藤 博幸		経済産業省産業技術環境局国際電気標準課	
(事務局)	中川 梓	一般財団法人日本規格協会	-
	山本 久義	一般財団法人日本規格協会	
	清水 祐貴	一般財団法人日本規格協会	

## 2. 委員会開催状況

開催年月日	委員会区分	出席者数又は回答者数(名)
2021年12月17日	産業標準作成委員会	10/10
2022年2月XX日(予定)	産業標準作成委員会	○/10

## 3. 作成審議経過

- ①産業標準案作成対象テーマの審議（JIS見直しの審議）；  
2021年12月17日 産業標準作成委員会議決
- ②JIS作成予定一覧表の公表；  
2021年12月24日～申出予定日（2022年2月下旬）までJSAウェブサイト掲載
- ③利害関係者の産業標準作成委員会への参加の確保；  
2021年12月24日～申出予定日（2022年2月下旬）までJSAウェブサイト掲載
- ④異議申立ての機会の確保；  
2021年12月24日～申出予定日（2022年2月下旬）までJSAウェブサイト掲載
- ⑤産業標準案の作成及び審議（確認の申出に係る審議）；  
2022年2月XX日（予定） 産業標準作成委員会議決
- ⑥議事録及び委員会資料の公開；  
2022年2月XX日（予定） JSAウェブサイト掲載

## 4. 利害関係者の産業標準作成委員会への参加に関する内容

参加： 無

## 5. 異議申立てに関する内容及び結果

異議申立ての有無： 無